

# 北京航空航天大学实验报告

实验名称: 光的干涉实验 1(分波面法) 钠光双棱镜干涉

# 一、实验重点

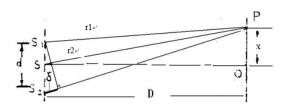
- 1. 熟练掌握采用不同光源进行光路等高共轴调节的方法和技术;
- 2. 用实验研究菲涅耳双棱镜干涉并测定单色光波长;
- 3. 学习用钠光和其他光源进行实验时不同的调节方法。

# 二、实验原理

## 1. 钠光双棱镜干涉

菲涅耳双棱镜可以看成是有两块底面相接、棱角很小的直角棱镜合成。若置单色光源 S 于双棱镜的正前方,则从 S 射来的光束通过双棱镜的折射后,变为两束相重叠的光,这两束光仿佛是从光源 S、的两个虚像  $S_1$  和  $S_2$  射出的一样。由于  $S_1$  和  $S_2$  是两个相干光源,所以若在两束光相重叠的区域内放置一个屏,即可观察到明暗相间的干涉条纹。

如图所示,设虚光源  $S_1$  和  $S_2$  的距离是 d,D 是虚光源到屏的距离。令 P 为屏上任意一点, $r_1$  和  $r_2$  分别为从  $S_1$  和  $S_2$  到 P 点的距离,则从  $S_1$  和  $S_2$  发出的光线到达 M 点的光程差是:



$$\triangle L = r_2 - r_1$$

令  $N_1$  和  $N_2$  分别为  $S_1$  和  $S_2$  在屏上的投影, O 为  $N_1N_2$  的中点, 并设 OP=x, 则从  $\triangle S_1N_1$ P 及  $\triangle S_2N_2$ P 得:

$$r_1^2 = D^2 + (x - \frac{d}{2})^2$$

$$r_2^2 = D^2 + (x + \frac{d}{2})^2$$

两式相减、得:

$$r_2^2 - r_1^2 = 2dx$$

另外又有  $r_2^2 - r_1^2 = (r_2 - r_1)(r_2 + r_1) = \Delta L(r_2 + r_1)$ 。通常 D 较 d 大的很多,所以  $r_2 + r_1$  近似等于 2D,因此光程差为:

$$\triangle L = \frac{dx}{D}$$

如果  $\lambda$  为光源发出的光波的波长,干涉极大和干涉极小处的光程差是:

$$\Delta L = \frac{dx}{D} = \begin{cases} k\lambda(k = 0, \pm 1, \pm 2, ...)$$
 明纹 
$$\frac{2k+1}{2}\lambda(k = 0, \pm 1, \pm 2, ...)$$
 暗纹

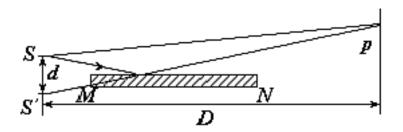
由上式可知,两干涉条纹之间的距离是:

$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$$

所以用实验方法测得  $\triangle x$ , D 和 d 后,即可算出该单色光源的波长:

$$\lambda = \frac{d}{D}\Delta x$$

## 2. 钠光劳埃镜干涉



劳埃镜实验是由一块普通的平板玻璃构成的反射镜实现分波前干涉。单色光源 S 发出的光 (波长为  $\lambda$ ) 以几乎掠入射的方式在平面镜 MN 上发生反射,反射光可以看做是在镜中的虚像 S'发出的。S 和 S'发出的光波在其交迭区域发生干涉,可得条纹间距为:

$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$$

式中 d 为双光源 S 和 S' 间距, D 为观察屏到光源的距离。

# 三、实验方案

#### 1. 光源的选择

当双棱镜与屏的位置确定之后,干涉条纹的间距 x 与光源的波长 成正比。为了获得清晰的干涉条纹,本实验采用单色光源钠光。

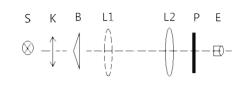
## 2. 测量方法

条纹间距  $\triangle x$  可直接用侧位目镜测出。虚光源间距 d 用二次成像的方法测 130 得: 当保持物、屏位置不变且间距 D 大于 4f 时,移动透镜可源在其间的两个位置成清晰的实像,一个是放大像,一个是缩小像。设 b 为虚光缩小像间距,b'为放大像间距,则两虚光源的实际距离为  $d=\sqrt{bb'}$ ,其中 b 和 b'由测微目镜读出,同时根据两次成像的规律,若分别测出呈缩小像和放大像时的物距 S、S',则物到像屏之间的距离 D=S+S'。根据波长的计算公式,得波长和各测量值之间的关系是:

$$\lambda = \frac{\Delta x \sqrt{bb'}}{S + S'}$$

## 3. 光路组成

具体的光路如图所示, S 为半导体激光器, K 为扩束镜, B 为双棱镜, P 为偏振片, E 为测微目镜。 L 为测虚光源间距 d 所用的凸透镜, 透镜位于  $L_1$  位置将使虚光源  $S_1S_2$  在目镜处成方大像,透镜位于  $L_2$  处将使虚光源在目镜出成缩小像。所



有光学元件都放在光具座上,光具座上附有米尺刻度读出各元件的位置。

# 四、实验仪器

光具座,双棱镜,测微目镜,凸透镜,扩束镜,偏振片,白屏,可调狭缝,钠光灯。

# 五、实验内容

## 1. 各光学元件的共轴调节

## 1) 调整狭缝与凸透镜登高共轴

将狭缝紧贴钠灯放在光具座上,接着依次放上透镜  $(f \approx 20cm)$  和白屏,用二次成像法使狭缝与透镜等高共轴。

#### 2) 调整测微目镜、狭缝和透镜等高共轴

用测微目镜取代白屏,并置于距狭缝 80cm 位置上,进一步用二次成像法调至测微目镜叉丝与狭缝、透镜等高共轴。

#### 3) 调双棱镜或劳埃镜与其他元件共轴

1. 双棱镜干涉: 在狭缝与透镜之间放上双棱镜, 使双棱镜到狭缝的距离约 20cm, 上下左右移动双棱镜并转动狭缝, 直至在测微目镜中观察到等长并列 (表示棱脊平行于狭缝)、等亮度 (表示棱脊透过透镜光轴) 的两条狭缝缩小像。

2. 劳埃镜干涉: 移去透镜, 在狭缝后面放上劳埃镜, 通过劳埃镜目测观察双光源像, 调整狭缝取向至两狭缝像相互平行, 在调整劳埃镜使双光源等亮且相距较近。

# 2. 干涉条纹的调整

- 1. 双棱镜干涉:在上述光学元件调整的基础上,移去透镜,进一步交替微调狭缝宽度和狭缝取向,反复若干次,直至通过测微目镜看到最清晰的干涉条纹为止。
- 2. 劳埃镜干涉:通过测微目镜进行观察,同时微微调节劳埃镜和狭缝取向,直至出现清晰的干涉条纹。

# 3. 波长的测量及数据处理

#### 1) 测条纹间距 △x

连续测量 20 个条纹的位置  $x_i$  。如果视场内干涉条纹没有布满,则可对测微目镜的水平位置略作调整;视场太暗可旋转偏振片调亮。

## 2) 测量虚光源缩小像间距 b 及透镜物距 S

测 b 时应在鼓轮正反向前进时,各做一次测量。注意: i) 不能改变扩束镜、双棱镜级测微目镜的位置; ii) 用测微目镜读数时要消空程。

3) 用上述同方法测量虚光源放大像间距  $\mathbf{b}'$  及透镜物距  $\mathbf{S}'$ 。